



## SYLLABUS

**1. Puni naziv nastavnog predmeta:**

Eksperimentalna fizika kondenzovane materije - odabrana poglavlja

**2. Skraćeni naziv nastavnog predmeta / šifra:**

EFKM

**3. Ciklus studija:**

2

**4. Bodovna vrijednost ECTS:**

6

**5. Status nastavnog predmeta:** Obavezni       Izborni**6. Preduslovi za polaganje nastavnog predmeta:**

Nema preduslova

**7. Ograničenja pristupa:**

upisani studenti II ciklusa

**8. Trajanje / semestar:** I       I**9. Sedmični broj kontakt sati:**

9.1. Predavanja:

3
0
0

9.2. Auditorne vježbe:

9.3. Laboratorijske / praktične vježbe:

**10. Fakultet:**

Prirodno-matematički

**11. Odsjek / Studijski program:**

Fizika / Primijenjena fizika

**12. Odgovorni nastavnik:**

Dr.sc. Izet Gazdić, vanr.prof

**13. E-mail nastavnika:**

izet.gazdic@untz.ba

**14. Web stranica:**

www.pmf.untz.ba

**15. Ciljevi nastavnog predmeta:**

Upoznati studente sa najnovijim metodama koje omogućavaju utvrđivanje složenih strukturnih karakteristika kondenziranih materijala, kao i potrebnih kriterija na osnovu kojih možemo identificirati kristalnu uređenost.

**16. Ishodi učenja:**

Na kraju kursa uspješni studenti, koji su tokom čitavog nastavnog perioda kontinuirano obavljali svoje obaveze, će biti oспособljeni da:

- razumiju strukturu kondenziranih materijala,
- znaju kako nastaju pojedini kondenzirani materijali,
- znaju njihove fizičke osobine i pojedine hemijske karakteristike navedenih materijala,
- upoznaju eksperimentalne metode određivanja strukture kondenziranih materijala,
- znaju teorijski objasniti fizičke pojave u ovim materijalima,
- znaju gdje se sve primjenjuju kondenzirani materijali u nauci i tehnici.

**17. Indikativni sadržaj nastavnog predmeta:**

Otkriće difrakcije elektromagnetskog zračenja na kristalnoj rešetki. Karakteristike elektromagnetskog zračenja. Izbor zračenja, Osobine X-zraka i monohromatizacija. Difrakcija X-zraka. Geometrija rasijanja. Laueov model. Bragov model. Evaldova konstrukcija. Intenzitet difrakcije. Opšti faktori od značaja za intenzitet. Strukturna amplituda. Primarna i sekundarna ekstinkcija. Difrakcione metode ispitivanja kristala. Metode difrakcije na uzorcima monokristala. Metoda Lauea. Oscilatorna metoda. Vajsenbergova metoda. Precesiona metoda. Metode difrakcije na polikristalnim uzorcima. Debaj-Šererova metoda. Difraktometar za polikristalne uzorke. Rasijanje X-zraka i atomska struktura materijala. Opšti principi rješavanja strukture. Utačnjavanje kristalnih struktura. Optička mjerena. Optička goniometrija. Elektronska mikroskopija. Polarizaciona mikroskopija. Određivanje indeksa prelamanja. Orientacione metode. Refraktometrijske metode. Direktna metoda prizme. Interferencione metode.

**18. Metode učenja:**

- Metod usmenog izlaganja,
- Metod pismenog izlaganja,
- Audio-vizuelni metod,
- metod razgovora,
- metod demonstracije,
- Interaktivni metod.

**19. Objasnjenje o provjeri znanja:**

Provjera znanja vrši se pismenim putem na kraju semestra.

**20. Težinski faktor provjere:**

Na završnom ispitu koji se polaže pismenim putem, na kraju odslušanog kursa, student može osvojiti 100 bodova.

Osvojeni broj bodova      Ocjena (BiH)

54-63	6
64-73	7
74-83	8
84-93	9
94-100	10

**21. Osnovna literatura:**

1. D.M. Petrović, S.R. Lukić, Eksperimentalna fizika kondenzovane materije, Novi Sad, 2000.
2. B. Đurić, Ž. Ćulum, Fizika V deo Teorija relativnosti-atomska i nuklearna fizika.
3. G.I. Epifanov, Solid State Physics, Moskow, 1979
4. L.H. Van Vlack, Elements of Materials Science and Engineering, New York, 1990.
5. Internet

**22. Internet web reference:**

sve reference koje sadrže nastavno gradivo predviđeno ovim kursem.

**23. U primjeni od akademske godine:**

2022-23.

**24. Usvojen na sjednici NNV/UNV:**

(max. 10 karak.)